

L 实验室仪器

P 在线折光仪

S 软件

A 自动化系统



**SCHMIDT
HAENSCH**

自公元1864-160年光电检测仪器制造经验

ATR-L

多波长自动折光仪

实现自动色散测量的光谱型多波长折光仪



参数	ATR-L
标度类型	折光率 (RI), 糖度 (Brix), %百分比浓度等其他用户自定义标度
量程	1.33000 - 1.70000 RI* / 100% Brix
分辨率/精度	0.00001 RI* / 0.01 Brix
准确度	± 0.00004 RI* / ± 0.03 Brix
再现性	± 0.00004 RI* / ± 0.03 Brix
测量时间 (单样品)	≤20秒 7波长全测量 (温度稳定); 单次样品测量
环境温度	+ 15° to + 40°C
自动温度补偿 控温范围 温度精度 温度准确度	内置固态帕尔贴电子控温 + 10°C 至 + 80°C 0.01°C ± 0.03°C (绝对值)
检测元件	2048 elements高分辨率线性CCD组件
样品池	不锈钢, 黑色Delrin®, Teflon®, Viton®, FFKM 密封
棱镜	YAG
光源 / 波长	7 个独立的LED, 波长: 480, 546, 589, 644nm (其它按用户需求450-950nm定制), 波长准确度: ± 2 nm
显示	LCD, 16 x 16 characters, 背光液晶
操作	20 键功能键盘
接口/界面	1 x RS232 C, 1x 并口, USB 可选
标准	具备依据GB/T10050-2009标准规定的参考波长为546nm及主色散定义的阿贝数测量能力
尺寸/重量	测量探头, 不锈钢: 260 x 190 x 220 mm (w x h x d); 控制单元: 220 x 110 x 290 mm (w x h x d); 重量: 8 kg
特点	覆盖可见光全范围的7波长自动色散测量 (中置插值法) **; 高性能, 内置高性能帕尔贴电子控温单元确保测量快速而精准。

* 标准环境(589 nm, 20°C)
** 自动阿贝数计算

折光仪应用

折光仪被广泛应用于各种样品, 进行快速无损、无耗材的折光率直接测量。

常见应用

- 产品纯度检测
- 质量控制
- 产品特征识别
- 光学活性物质鉴定
- 光能测量参考光为546nm的固体和液体RI。

多波长检测的典型应用

- 测量色散、直读阿贝数
- 玻璃或塑料镜片 (如隐形眼镜) 的测量
- 针对人工晶体疏水性/亲水性的质量控制
- 标准方法的折光率检测及针对液态烃类色散的测量, 遵循 ASTM 1218。
- 光纤组件的测试
- 可以测试2种组分液体的浓度



**SCHMIDT
HAENSCH**
innovators by tradition since 1864

施密特汉熙仪器 (上海) 有限公司
Schmidt + Haensch Instruments (Shanghai) CO., LTD.
中国·上海
021 56013875 56013975
sales@schmidt-haensch.com.cn
<https://www.schmidt-haensch.com.cn>

